

希望審査分野、装置等の一覧表(2021.11.8更新)

大分類 (審査分野)	中分類	小分類	装置名	参考：2021B期までの 主な分科会
小角・広角散乱	小角散乱 広角散乱	物質材料系 生物系 その他	X線散乱測定装置 (BL40B2) 高時間分解X線回折・散乱装置 (BL40XU) マイクロビームX線散乱装置 (BL40XU) 極小角散乱測定装置 (BL20XU) 小角・広角散乱装置 (BL05XU)	D5, L2
X線回折 (単結晶)	結晶構造解析 電子密度解析 in-situ operando単結晶回折 格子歪み	有機系結晶 金属錯体 無機系結晶 MOF その他	高エネルギーX線構造解析装置 (BL02B1) 汎用型多軸回折計 (BL02B1) ピンポイント構造計測装置 (BL40XU)	D1a, D1b
X線回折 (粉末)	定性分析 定量分析 リートベルト解析 電子密度解析 in-situ operando粉末回折 格子歪み 結晶子サイズ 結晶角解析 配向度解析	有機系結晶 金属錯体 無機系結晶 MOF その他	自動その場粉末回折装置 (BL02B2)	D1a, D1b
X線回折 (汎用・構造評価)	PDF 逆格子マッピング 反射率 CTR ナノ回折 回折トポグラフィ 応力測定 薄膜X線回折 in-situ operando X線回折	非晶質材料 表面・界面 薄膜 ナノ構造 その他	検出器7連装PDF解析装置 (BL04B2) 時分割PDF解析装置 (BL08W) 多目的6軸X線回折計 (BL13XU) (2022A期から) ピンポイント構造計測装置 (BL40XU) マイクロ・ナノビームX線回折装置 (BL13XU) 白色X線回折計 (BL28B2) 全散乱計測装置 (BL44B2) オープンハッチ (BL29XU)	D6a, D6b
X線回折 (高圧)	高圧構造解析 高圧ラジオグラフィ	高圧物性 材料合成 地球・惑星科学 超高圧発生技術 その他	大容量高圧発生装置(SPEED-1500) (BL04B1) 変形機構付き大容量高圧発生装置(SPEED-Mk II) (BL04B1) 低温高圧X線回折装置 (BL10XU) 高圧マイクロX線回折装置 (BL10XU)	D2a, D2b

大分類 (審査分野)	中分類	小分類	装置名	参考：2021B期までの 主な分科会
汎用XAFS汎用MCD	汎用XAFS (HX、SXを含む) XMCD (HX、SXを含む) 複合XAFS (HX、SXを含む) in-situ XAFS (HX、SXを含む) 時分割XAFS	電池・触媒材料 磁性材料 構造材料 高圧物性 その他	XAFS計測装置 (BL01B1) XAFS-IR同時計測装置 (BL01B1) 高速時間分解QXAFS装置 (BL36XU) 電磁石式軟X線MCD装置 (BL25SU) 複合極限環境下硬X線XAFS/MCD装置 (BL39XU)	S3, Xa
先端X線分光	分光イメージング 磁性イメージング X線発光分光 X線ラマン散乱 蛍光X線分析 微量分析	電池・触媒材料 磁性材料 物性科学 生物・医学系材料 地学・環境系物質、 その他	走査型顕微分光計測装置 (BL37XU) 全視野型顕微分光計測装置 (BL37XU) 走査型硬X線XAFS/MCD顕微鏡 (BL39XU) 走査型軟X線顕微分光計測装置 (BL17SU) 走査型軟X線顕微分光計測装置 (BL27SU) X線発光分光装置(高エネルギー分解能蛍光検出XAFSを含む) (BL39XU) 軟X線発光分光装置 (BL27SU) 蛍光X線分析装置 (BL08W)	Xa, Xb
光電子分光	HAXPES PES (SX) PEEM	物性科学 磁性材料 デバイス評価 電池・触媒材料 その他	汎用硬X線光電子分光装置 (BL46XU) 高エネルギー分解能HAXPES装置 (BL09XU) 3次元空間分解HAXPES装置 (BL09XU) 軟X線マイクロビームARPES (BL25SU) 光電子顕微鏡(PEEM) (BL17SU) 光電子顕微鏡(PEEM) (BL25SU) 阻止電場型分析器 (RFA) (BL25SU) オープンハッチ (BL19LXU)	S1
赤外分光	赤外分光 赤外イメージング	化学系材料 赤外物性 その他	磁気光学顕微鏡 (BL43IR) 長作動距離顕微鏡 (BL43IR) 高空間分解顕微鏡 (BL43IR)	S1
イメージング	マイクロ/ナノCT 高速度撮影 トポグラフィ 光学素子開発評価	物質材料系 生物・医学系 地球・惑星科学 イメージング技術開発 その他	マルチスケール・マルチモードCT (BL20XU) 広視野X線イメージング装置 (BL20B2) 高エネルギーX線イメージング装置 (BL28B2) 白色X線回折計 (BL28B2) X線ナノCT/ナノイメージング (BL47XU) 高速度X線イメージング装置 (BL40XU) ラミノグラフィ (BL20XU) ラミノグラフィ (BL20B2) ラミノグラフィ (BL28B2) ラミノグラフィ (BL47XU) 高分解能・高速X線イメージング装置 (BL20XU) 高分解能・高速X線イメージング装置 (BL47XU) オープンハッチ (BL29XU)	D3, L3

大分類 (審査分野)	中分類	小分類	装置名	参考：2021B期までの 主な分科会
非弾性散乱	核共鳴散乱 高分解能X線非弾性散乱 コンプトン散乱	核共鳴散乱 (弾性含む) 高分解能X線非弾性散乱 コンプトン散乱 その他	高分解能非弾性X線散乱装置 (meV IXS) (BL35XU) 磁気コンプトン散乱装置 (BL08W) 高分解能コンプトン散乱装置 (BL08W) 核共鳴非弾性散乱装置 (BL35XU) γ線準弾性散乱装置 (BL35XU) 放射光メスバウア分光装置 (BL35XU) コンプトン散乱イメージング装置 (BL08W) オープンハッチ (BL19LXU)	D4
構造生物学	生体高分子結晶回折 生物試料溶液散乱 クライオ電子顕微鏡	生体高分子結晶回折 生物試料溶液散乱 生体高分子結晶回折 + CryoTEM 生体高分子結晶回折 + 生物試料溶液散乱 生物試料溶液散乱 + CryoTEM 生体高分子結晶回折 + 生物試料溶液散乱 + CryoTEM	生体高分子結晶用回折計 (BL41XU) 高エネルギーX線用回折計 (BL41XU) 生体高分子結晶回折測定自動システム (BL45XU) 生体高分子結晶解析用回折計 (BL26B1) 生体高分子結晶解析用回折計 (BL26B2) 生体高分子結晶用回折計 (BL32XU) バイオ試料用オンラインHPLC (BL38B1) バイオ試料用精密温調溶液セル (BL38B1) クライオ電子顕微鏡 (EM01CT) クライオ電子顕微鏡 (EM02CT)	L1, L2
産業利用	散乱回折 分光・分光イメージング イメージング 非弾性散乱 その他	小角・広角散乱 X線回折 (単結晶) X線回折 (粉末) X線回折 (汎用・構造評価) X線回折 (高圧) 汎用XAFS・汎用MCD 先端X線分光 光電子分光 赤外分光 イメージング 非弾性散乱 その他	汎用XAFS測定装置 (BL14B2) その場XAFS測定装置 (BL14B2) 汎用X線イメージング装置 (BL14B2) 小角・極小角散乱測定装置 (BL19B2) ハイスルーブット粉末X線回折計 (BL19B2) 多目的6軸X線回折計 (BL19B2) 汎用硬X線光電子分光装置 (BL46XU) 多目的6軸X線回折計 (BL46XU) (2021B期まで) 上記装置を含む全装置から選択可能 (ビームラインから選択してください)	I
人文・社会科学	散乱回折 分光・分光イメージング イメージング 非弾性散乱 その他	小角・広角散乱 X線回折 (単結晶) X線回折 (粉末) X線回折 (汎用・構造評価) X線回折 (高圧) 汎用XAFS・汎用MCD 先端X線分光 光電子分光 赤外分光 イメージング 非弾性散乱 その他	BL14B2およびBL19B2を除く全装置から選択可能 (ビームラインから選択してください)	HS
その他 (持込装置利用)	主に持ち込み装置利用	蛍光X線ホログラフィー その他持ち込み装置利用	オープンハッチ (BL47XU) オープンハッチ (BL19LXU) オープンハッチ (BL29XU) その他	D6b